

# **АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

## **Рентгеноструктурный анализ**

по направлению подготовки: 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов»

по профилю: «Материаловедение и технологии наноматериалов и наносистем»

Квалификация выпускника: БАКАЛАВР

Выпускающая кафедра: ПНТВМ

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов»

### **1. Цели освоения дисциплины**

Целями освоения дисциплины «Рентгеноструктурный анализ» являются:

- а) сформировать у студента представления об основах рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа, включающие основные законы кристаллографии, физические процессы, происходящие при взаимодействии рентгеновских лучей с веществом, экспериментальную технику рентгеноструктурного анализа, а также возможности и области применения метода.
- б) привить навыки работы на экспериментальном оборудовании, анализа полученных результатов и их использования для решения практических задач.

### **2. Содержание дисциплины «Рентгеноструктурный анализ»:**

Кристаллы и нанокристаллы

Рентгеноструктурный анализ

Теория рентгеновских лучей

Аппаратура для рентгеноструктурного анализа

Рентгеноструктурный анализ кристаллов

Качественный рентгенографический фазовый анализ

Количественный рентгенографический фазовый анализ

Методы полнопрофильного анализа, метод Ритвельда

### **3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:**

1) Знать:

- а) основные понятия, закономерности и физическую суть метода рентгеноструктурного анализа;
- б) методы рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа в дифрактометрическом и фотографическом вариантах;
- в) устройство аппаратуры для рентгенофазового анализа;
- г) методы качественной и количественной фазовой диагностики;
- д) этапы расшифровки структур;
- е) различия дифракционных картин микрокристаллических и нанокристаллических объектов.

2) Уметь:

- а) выполнять лабораторные работы на основе приобретенных теоретических навыков и освоения методов работы на рентгеновском дифрактометре;
- б) пользоваться базами дифракционных данных;
- в) рассчитывать межплоскостные расстояния и интенсивности дифракционных максимумов;
- г) индицировать рентгенограмму и определять параметры элементарной ячейки;
- д) определять неизвестное вещество по рентгendifракционному спектру, проводить фазовую диагностику многокомпонентных смесей;
- е) использовать различные методы количественной диагностики фаз;
- ж) рассчитывать другие структурные параметры (размеры кристаллитов, количество

- дефектов);
- 3) использовать полнопрофильные методы анализа дифрактограмм.
- 3) Владеть:
- а) терминологией рентгеноструктурного анализа и кристаллографии;
  - б) методиками проведения дифракционного эксперимента и анализа дифракционных данных;
  - в) навыками работы с лабораторным оборудованием и современной научной аппаратурой, а именно рентгеновским порошковым дифрактометром, комплексом инструментов пробоподготовки и современными пакетами программ по обработке дифракционных данных.

Зав. каф. ПНТВМ

Вознесенский Э.Ф.